



Statystyka w Metrologii – Wprowadzenie

Indeks: 710878 Producent: Springer

Cena: 608.36 zł

Opis

Introduction to Statistics in Metrology

Producent: Springer

"Wprowadzenie do Statystyki w Metrologii" to niezbędna lektura dla wszystkich zainteresowanych systemami pomiarowymi, nauką o miarach oraz inżynierią elektryczną i mechaniczną. Autorzy, Stephen Crowder, Collin Delker, Eric Forrest i Nevin Martin, proponują kompleksowe podejście do zagadnień związanych z jednostkami miar, standardami pomiarowymi, analizą niepewności, projektowaniem eksperymentów i systemami pomiarowymi binarnymi. Ta unikatowa książka wychodzi poza standardowe ramy i otwiera nowe perspektywy w statystyce inżynierskiej oraz naukach ścisłych.

Zawartość pracy obejmuje nie tylko podstawy statystyki, ale również zaawansowane techniki mierzenia i analizy danych w kontekście międzynarodowego systemu jednostek. Książka skupia się na normach naukowych, standardach pomiarowych i analizie niepewności, stawiając silny akcent na badania eksperymentalne i metody ANOVA. Oprócz tego, autorzy poruszają zagadnienia związane z elektryką, mechaniką, fizyką, informatyką, chemią i naukami o Ziemi, tworząc kompleksowy przegląd statystyki w różnych dziedzinach techniki i nauki.

Zanurz się w fascynującym świecie statystyki inżynierskiej i nauk ścisłych z książką "Wprowadzenie do Statystyki w Metrologii". Ta pierwsza edycja z 2020 roku dostarcza najnowszej wiedzy na temat pomiarów, analizy danych i projektowania eksperymentów. Poznaj tajniki statystycznej teorii i metod oraz odkryj praktyczne zastosowania w elektryce, mechanice i innych dziedzinach techniki. Przekroczenie granic statystyki jeszcze nigdy nie było tak interesujące!

- temat:** Probability & statistics, Mensuration & systems of measurement, Electrical engineering, Mechanical engineering, MATHEMATICS / Probability & Statistics / General, MATHEMATICS, Probability & Statistics, General, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Measurement, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Measurement, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electrical, Electrical, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Mechanical, Mechanical, Statistics for Engineering, Physics, Computer Science, Chemistry and Earth Sciences, Measurement Science and Instrumentation, Statistical Theory and Methods, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Statistics in Engineering, Physics, Computer Science, Chemistry and Earth Sciences, Electrical and Electronic Engineering, HC/Naturwissenschaften allgemein, HC, Naturwissenschaften allgemein, HC/Technik/Allgemeines, Lexika, Technik, Allgemeines, Lexika, HC/Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik, Mathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik, HC/Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, HC/Technik/Maschinenbau, Fertigungstechnik, Maschinenbau, Fertigungstechnik, International System of Units;measurement standards;traceability chain;uncertainty analysis;propagation or error;design of experiments;ANOVA;binary measurement systems, Probability and statistics, Scientific standards, measurement etc, MATHEMATICS / Probability & Statistics / General, Mathematics/Probability & Statistics - General, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electrical, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Measurement, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Mechanical, Technology & Engineering/Electrical, Technology & Engineering/Measurement, Technology & Engineering/Mechanical, Electrical engineering, Mechanical engineering, Mensuration & systems of measurement, Probability & statistics, Elektrotechnik, Maschinenbau, Probability and

statistics, Scientific standards, measurement etc, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Wissenschaftliche Standards, Normung usw., HC/Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik, HC/Naturwissenschaften allgemein, HC/Technik/Allgemeines, Lexika, HC/Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, HC/Technik/Maschinenbau, Fertigungstechnik, Hardcover, Softcover / Naturwissenschaften allgemein

- **wiążący:** paperback
- **język:** english, english, english
- **waga przedmiotu:** 569 grams
- **strony:** 368
- **słowo kluczowe tematu:** International System of Units;measurement standards;traceability chain;uncertainty analysis;propagation or error;design of experiments;ANOVA;binary measurement systems, International system of units; measurement standards; traceability chain; Uncertainty Analysis; propagation or error; Design of Experiments; ANOVA; binary measurement systems
- **kod podmiotu:** THR, TGB, PBT, PDD, PBT, PDD, MAT029000, MAT029000, TEC007000, TEC022000, TEC009070, TEC007000, TEC022000, TEC009070, THR, TGB, PDDM, PBT, 1627, 1610, 1681, 1684, 1682, 1610
- **grupa docelowa:** General/trade
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **kolor:** Yellow
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.45 pounds
- **wydanie:** 1st ed. 2020
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 303053331X, 9783030533311, 09783030533311
- **producent:** Springer
- **autor:** Crowder, Stephen, Delker, Collin, Forrest, Eric, Martin, Nevin
- **gatunek muzyczny:** Probability & statistics, Mensuration & systems of measurement, Electrical engineering, Mechanical engineering, MATHEMATICS, Probability & Statistics, General, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Measurement, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Electrical, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Mechanical, HC, Naturwissenschaften allgemein, HC, Technik, Allgemeines, Lexika, HC, Mathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik, HC, Technik, Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, HC, Technik, Maschinenbau, Fertigungstechnik, Probability and statistics, Scientific standards, measurement etc, Electrical engineering, Mechanical engineering
- **Data publikacji:** 2021-12-02T00:00:01Z
- **numer wydania:** 1
- **nazwa przedmiotu:** Introduction to Statistics in Metrology
- **data premiery:** 2021-12-02T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-11-05T05:43:16.083Z

Parametry

Format	miękka oprawa
Wielkość	368 stron
Waga	569 gramów
Język	angielski
Wydanie	1st ed. 2020